RFマグネトロンスパッタリング法による酸化ニオブ薄膜の光触媒効果

| 日大生産工 | (院) | ○杉崎   | 紀彦 |
|-------|-----|-------|----|
| 日大生産工 | 新妻  | 清純・移川 | 欣男 |

#### <u>1.はじめに</u>

TiO<sub>2</sub>における光触媒は 1960 年代後半に本 多-藤島らによって発見された。この光触媒 効果を有する TiO<sub>2</sub>の粒子をガラス基板上に 塗付し紫外線照射すると,酸化還元反応およ び親水性効果により膜についた汚れを水で 浮かせて落とすことができ,防汚,親水,環境浄 化等の観点から各種用途への利用が拡大し てきている。また,TiO<sub>2</sub>に窒素や金属イオン をドープすることにより可視光応答するこ とが確認されている<sup>1)</sup>。

近年,光触媒効果を有する新物質として, 酸化ニオブが注目されており,ガラスに膜を 高温で焼き付ける場合,ガラスに含まれるナ トリウムが溶け出すことによる光触媒効果 の減衰が TiO<sub>2</sub>に比べ小さいことが確認され ている<sup>2)</sup>。

そこで,本研究ではRFマグネトロンスパッ タリング法を用いて種々の作製条件により 得られた酸化ニオブ膜の結晶構造,吸収スペ クトル,表面形状,酸化分解反応および親水性 の光触媒活性の諸特性ならびに電気抵抗率 およびバンドギャップの電気的特性につい て検討した。

#### 2.実験方法

本研究では,RF マグネトロンスパッタリン グ法により,試料を作製した。装置の概略図を Fig.1 に示す。成膜において,ターゲットには 厚さ 3mm,直径 33mm  $\phi$ 純度 99.9%Nb を用い た。まず,チャンバー内の最終到達真空度を



Fig.1 Schematic diagram of RF magnetron sputtering apparatus.

5.0×10<sup>4</sup>Pa まで高真空排気した後,Ar+5%O<sub>2</sub> 混合ガスを用い,成膜ガス圧を3.0Pa一定とし た。その後,高周波電源により投入電力150W 一定として放電を行い,ターゲットより一定 の距離(55mm)を隔てた基板上へ膜厚がほぼ 500nm 一定となるように成膜を行った。基板 として,テンパックスガラス基板を用いた。試 料作製後,電気炉を用い673~973Kの温度で 熱処理を施した。

### 3.評価方法

試料の評価方法として,結晶構造解析には Cu-K<sub>α</sub>を線源とする X 線回折装置(XRD),吸 収スペクトルならびバンドギャップの測定 には紫外可視分光光度計(UV-Vis),表面形状 観察には原子間力顕微鏡(AFM),酸化分解(色 素分解)反応の測定には濃度 1mmol/ℓのメチ レンブルーを塗布し光触媒チェッカーを,膜 厚の測定には繰り返し反射干渉計,電気抵抗

Photocatalytic Effect of Niobium Oxide Film by RF Magnetron Sputtering Method Norihiko SUGISAKI,Kiyozumi NIIZUMA,and Yoshio UTSUSHIKAWA 率の測定には直流四端子法,接触角の測定に は酸化ニオブ膜に可視光,紫外線を照射し膜 の表面に滴下した純水をデジタルカメラで 撮影し評価した。なお,電気抵抗ならびに接触 角測定時の可視光光源には蛍光灯(中心波 長:580nm)を,紫外光光源にはブラックライト (強度:1mW/cm<sup>2</sup>,中心波長:365nm)を用いた。

### <u>4.実験結果</u>

## 4.1 結晶構造解析

測定範囲 2 $\theta$  =20~80°における熱処理前 と各温度で熱処理した酸化ニオブ膜の X 線 回折図形を Fig.2 に示す。図より,作製した膜 のうち,熱処理前および 773K以下で熱処理 を施した試料では酸化ニオブの顕著な回折 線は確認できなかったが,873K以上で熱処理 を施した試料では,2 $\theta$  =17.0°,22.6°,28.3°, 32.1°,36.5°,46.1°,51.0°,55.0°,71.1°付近に, Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> である(130),(001),(180),(250),(181), (002),(380),(182),(382)の各回折線が認められ, 斜方晶の結晶構造を有していることが確認 できた。

## <u>4.2 光吸収端波長λ</u> <u>プE</u>の熱処理依存性

熱処理前と各温度で熱処理した酸化ニオ ブ膜の吸収スペクトルの波長依存性をFig.3 に示す。熱処理を施すことによって吸収端波 長 $\lambda_0$ は長波長にシフトすることが分かる。 また,熱処理温度が上昇するに伴い,吸収端波 長 $\lambda_0$ は可視光波長側にシフトすることが明 らかとなった。特に,973Kで熱処理したもの が顕著な傾向を示し,吸収端波長は 600nmと 最大となった。

次に,熱処理前と各温度で熱処理した酸化 ニオブ膜における光吸収端波長 $\lambda_0$ ならびに バンドギャップ $E_g$ の熱処理依存性をTable1 に示す。なお,バンドギャップ $E_g$ は,UV-Visス ペクトルの吸収端から次式で求めることが







Fig.3 Dependence of absorption spectra on annealing temperature.



Niobium Oxide films.

できる。

 $\alpha \cdot h \nu = (h \nu - E_g)^n \cdot \cdot \cdot (1)$ 

上式より、 $(\alpha \cdot h \nu)^{1/2}$ を光エネルギー $h \nu$ に対して吸収端近傍の接線を引き、x軸との切片からFig.4 よりEgを決定する。

表より,熱処理を施すことによって,バンド ギャップは低下し,973Kにおいて最小値 2.55eVを示し,可視光波長に反応する可能性 を示した。

## <u>4.3</u>酸化分解(色素分解)反応の紫外線照射時 間依存性

熱処理前と各温度で熱処理した酸化ニオ ブ膜に塗布したメチレンブルー色素に対す る吸光度の紫外線照射時間依存性をFig.5 に 示す。吸光度の減少が顕著であるほど膜表面 で生じる酸化分解反応が高いといえる。図よ り,紫外線照射時間の増加に伴いすべての試 料において,吸光度は減少する傾向を示した。 可視光照射時の773Kにおいて最も減少傾向 が認められ,-0.078 と最小値を示した。

# <u>4.4 純水における接触角の可視光ならびに紫</u> <u>外線照射時間依存性</u>

熱処理前と各温度で熱処理した酸化ニオ ブ膜の純水における接触角の可視光照射時 間依存性をFig.6 に示す。図より熱処理前の 試料において顕著な接触角の減少は認めら れなかったが,熱処理を施すことにより接触 角の減少が確認できた。可視光照射時で は,773Kで熱処理を施した試料において最も 小さな接触角を示した。

次に,純水における接触角の紫外線照射依 存性をFig.7 に示す。図より紫外線を照射す る事によりすべての試料において,接触角の 減少が確認できた。特に,673Kで熱処理を施 した試料では紫外線照射 240min後において 接触角約 9°を示した。

Table 1 Dependence of absorption edge  $\lambda_0$  and band gap  $E_g$  on annealing temperature.

| Temperature [K] | Absorption edge $\lambda_0$ [nm] | Band gap<br>E <sub>g</sub> [eV] |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| as-deposited    | 346                              | 3.66                            |
| 673             | 350                              | 3.64                            |
| 773             | 362                              | 3.57                            |
| 873             | 396                              | 3.41                            |
| 973             | 600                              | 2.55                            |



annealing temperature under UV irradiation time.



Fig.6 Dependence of contact angle for water on Niobium Oxide films under Vis. irradiation time.



Fig.7 Dependence of contact angle for water on Niobium Oxide films under UV irradiation time.

4.5 表面粗さの熱処理依存性

熱処理前と各温度で熱処理した酸化ニオ ブ膜の表面粗さにおける熱処理依存性を Fig.8 に示す。図より熱処理温度が上昇する に伴い,表面粗さRaは増加傾向を示した。こ れは結晶化が進んだためだと考えられる。



Fig.8 Dependence of the average of surface roughness for Niobium Oxide films annealed at various temperature.

### <u>5.まとめ</u>

RFマグネトロンスパッタリング法により, 酸化ニオブ膜を作製し,熱処理を施した試料 について,結晶構造,吸収スペクトル,可視光, 紫外線照射時における光触媒活性の挙動等 を評価し,これらの諸物性について検討した。 本実験をまとめると次の通りである。

- (1) X線回折による結晶構造解析より,作製し た試料のうち,熱処理前および 773K以下 で熱処理を施した試料では顕著な回折線 は認められなかった。また,873K以上で熱 処理を及ぼすことに
- (2) よりNb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>の回折線が認められ,斜方晶の 結晶構造を有していることが確認できた。
- (3) 吸収スペクトルの波長依存性より,熱処 理温度が上昇するに伴い吸収端波長え。 が可視光波長側にシフトすることが明ら かになった。また,973Kでのバンドギャッ プEg=2.55eV最小となり,可視光波長応 答に対応していることが分かった。
- (4) 色素分解反応の紫外線照射依存性より、 773Kで熱処理した試料で最も吸光度が 減少し,最小値である-0.078を示した。
- (5) 純水における接触角の測定より,可視光 照射時において熱処理前の試料では顕著 な変化は確認されず,773Kで熱処理を施 した試料において接触角約15°を示した。 また,紫外線照射時においてすべての試 料で接触角の減少が確認され,673Kで熱 処理を施した試料において接触角約9°を 示した。
- (6) 表面粗さの熱処理依存性より,熱処理温 度を上げるにつれ,表面粗さRaは増加傾 向を示した。

### 参考文献

- (1)橋本和仁,大谷文章,工藤昭彦:「光触媒 基礎・材料開発・応用」開成堂印刷株式 会社(2005)
- (2) 朝日新聞 2008 年 4 月 4 日 10 ページ経済 欄
- (3) 杉崎紀彦,新妻清純,移川欣男:「RFマグネ トロンスパッタリング法による酸化ニオ ブ膜の諸物性」電気学会基礎・材料・共 通部門大会,XII-4(2010)